

Acreditação N°	53
Data da Acreditação	09/05/1994
ACREDITAÇÃO VIGENTE	Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo	26/04/2022
Razão Social	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Nome do Laboratório	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Situação	Ativo
Endereço	RUA PRÍNCIPE HUMBERTO, 349/355
Bairro	VILA DUZZI
CEP	09725200
Cidade	S.BERNARDO DO CAMPO
UF	SP
Telefone	(11) 4121-2035
Fax	(11) 4121-2035
Grupo de Serviço de Calibração	ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico	PAULO RODRIGO MIYAZAKI
Email	tecnico@balitek.com.br

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
<i>(Realizados nas instalações permanentes)</i>		
MEDIDAS DE CORRENTE AC		
Fonte de Corrente AC	0,1 até 10 A (60 Hz)	*0,5%
	Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão	
Medidor de Corrente AC	50 μ A até 330 μ A	2,47%
	>0,33 mA até < 330 mA	0,15%
	0,33 A até < 2,2 A	0,30%
	2,2 A até < 11 A	0,28%
	11 A até 20 A	*0,33%
	De 16,5 A até < 55 A	*1,1%
	De 55 A até < 150 A	*0,49%
	De 150 A até < 550 A	*0,33%
	De 550 A até 1000 A	*0,2%
	Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão	
	Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão e bobina amperimétrica	
MEDIDAS DE CORRENTE DC		
Fonte de Corrente DC	1 μ A até 100 μ A	0,04%
	>100 μ A até 1 mA	0,02%
	2,5 mA até 10 A	0,04%
	Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão	
Medidor de Corrente DC	0,02 mA até 3,3 mA	0,3%
	>3,3 mA até 330 mA	0,02%
	De 0,33 A até < 2,2 A	0,05%
	De 2,2 A até 11 A	0,1%
	De 11 A até 20 A	*0,15 %
	De 16,5 A até < 55 A	*1,1%
	De 55 A até < 150 A	*0,4 %
	De 150 A até < 550 A	*0,12 %
	De 550 A até 1000 A	*0,07%
	Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão	
	Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão e bobina amperimétrica	
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA		
Década Resistiva, em Corrente Contínua	1 Ω até 10 Ω	0,04%
	>10 Ω até 100 Ω	0,02%
	>100 Ω até 10 k Ω	0,01%
	>10 k Ω até 100 k Ω	0,009%
	>100 k Ω até 1000 k Ω	0,01%
	>1 M Ω até 10 M Ω	0,2%
	>10 M Ω até 100 M Ω	2%
	Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão	
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua	1 Ω até 11 Ω	0,1%
	>11 Ω até 33 Ω	0,2%
	>33 Ω até 110 Ω	0,06%

	>110 Ω até 1,1 k Ω	0,03%
	>1,1 k Ω até 3,3 k Ω	0,02%
	>3,3 k Ω até 11 k Ω	0,03%
	>11 k Ω até 33 k Ω	0,02%
	>33 k Ω até 110 k Ω	0,03%
	>110 k Ω até 330 k Ω	0,02%
	>330 k Ω até 1,1 M Ω	0,04%
	>1,1 M Ω até 3,3 M Ω	0,02%
	>3,3 M Ω até 33 M Ω	0,1%
	>33 M Ω até 100 M Ω	0,6%
	Método de comparação direta com década resistiva padrão	
	Método de comparação direta com calibrador padrão	
MEDIDAS DE TENSÃO AC		
Fonte de Tensão AC	250 mV a 100 V	0,5%
	>100 V a 1000 V	0,7%
	Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão	
Medidor de Tensão AC	>180 mV até 330 mV (60 Hz)	0,27%
	>0,33 V até 3,3 V (60Hz)	0,10%
	>3,3 V até 33V (60Hz)	0,061%
	>33 V até 330 V (60Hz)	0,19%
	>330 V até 1000V (60Hz)	0,20%
	Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão	
MEDIDAS DE TENSÃO DC		
Fonte de Tensão DC	10 mV até 100 mV	0,04%
	>0,1 V até 1 V	0,006%
	>1 V até 10 V	0,004%
	>10 V até 100 V	0,005%
	>100 V até 1000 V	0,004%
	Método de comparação direta com multímetro padrão	
Medidor de Tensão DC	10 mV até 330 mV	0,04%
	>0,33 V até 33 V	0,007%
	>33 V até 330 V	0,008%
	>330 V até 1000 V	0,007%
	Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão	
(Realizados nas instalações do cliente)		
MEDIDAS DE CORRENTE DC		
Fonte de Corrente DC	2,5 mA até 10 A	0,04 %
	Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão	
	1 μ A até 100 μ A	* 0,04 %
	> 100 μ A até 1 mA	* 0,02 %
	> 1 mA até 10 A	* 0,04 %
	Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão	
Medidor de Corrente DC	0,02 mA até 3,3 mA	* 0,3 %
	> 3,3 mA até 330 mA	* 0,02 %
	> 330 mA até 2,2 A	* 0,05 %
	> 2,2 A até 11 A	* 0,1 %
	Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão	
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA		
Década Resistiva, em Corrente Contínua	1 Ω até 10 Ω	* 0,04 %
	> 10 Ω até 100 Ω	* 0,02 %
	> 100 Ω até 10 k Ω	* 0,01 %
	> 10 k Ω até 100 k Ω	* 0,009 %
	> 100 k Ω até 1000 k Ω	* 0,01 %
	> 1 M Ω até 10 M Ω	* 0,2%
	> 10 M Ω até 100 M Ω	* 2 %
	Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão	
	Método de comparação direta com década resistiva padrão	
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua	1 Ω até 11 Ω	* 0,1 %
	> 11 Ω até 33 Ω	* 0,2 %
	> 33 Ω até 110 Ω	* 0,06 %
	> 110 Ω até 1,1 k Ω	* 0,03 %
	> 1,1 k Ω até 3,3 k Ω	* 0,02 %
	> 3,3 k Ω até 11 k Ω	* 0,03 %
	> 11 k Ω até 33 k Ω	* 0,02 %
	> 33 k Ω até 110 k Ω	* 0,03 %
	Método de comparação direta com calibrador	
MEDIDAS DE TENSÃO AC		
Medidor de Tensão AC	>180 mV até 330 mV (60Hz)	0,27%
	>0,33 V até 3,3 V (60Hz)	0,10%
	>3,3 V até 33V (60Hz)	0,061%
	>33 V até 330 V (60Hz)	0,19%
	>330 V até 1000V (60Hz)	0,20%
	Método de comparação direta com fonte de Tensão ou	



Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.





Sites de Interesse

Mapa do Site

Ouvidoria

Fale com o Inmetro



Consulta

Acreditação N°	53
Data da Acreditação	09/05/1994
ACREDITAÇÃO VIGENTE	Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo	26/04/2022
Razão Social	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Nome do Laboratório	BALITEK INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Situação	Ativo
Endereço	RUA PRÍNCIPE HUMBERTO, 349/355
Bairro	VILA DUZZI
CEP	09725200
Cidade	S.BERNARDO DO CAMPO
UF	SP
Telefone	(11) 4121-2035
Fax	(11) 4121-2035
Grupo de Serviço de Calibração	TEMPO E FREQUÊNCIA
Gerente Técnico	PAULO RODRIGO MIYAZAKI
Email	tecnico@balitek.com.br

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO

Descrição do Serviço	Parâmetro, Faixa e Método	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
<i>(Realizados nas instalações permanentes)</i>		
MEDIDAS DE FREQUÊNCIA		
Gerador de Frequência	0,1 Hz até 2,3 GHz Método de comparação com contador eletrônico / contador universal	0,00002%
Medidor de Frequência	0,1 Hz até 990 MHz 5 rpm até 100000 rpm Método de comparação com gerador de frequência padrão	0,00002% 0,001%
MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO		
Medidor de Intervalo de Tempo	5 ns até <1 s 1 s até 1000 s >1000 s até 12 h Método de comparação com gerador de intervalo de tempo padrão	0,00002% 0,0002% 0,035 s
<i>(Realizados nas instalações do cliente)</i>		
MEDIDAS DE FREQUÊNCIA		
Gerador de Frequência	0,1 Hz até 2,3 GHz Método de comparação com contador eletrônico / contador universal	0,00002%
Medidor de Frequência	0,1 Hz até 990 MHz Método de comparação com gerador de frequência padrão	0,00002%
MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO		
Medidor de Intervalo de Tempo	5 ns até <1 s 1 s até 1000 s >1000 s até 12 h Método de comparação com gerador de intervalo de tempo padrão	0,00002% 0,0002% 0,035 s



Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.